CDx4AC373、CDx4ACT373 オクタル トランスペアレント ラッチ、3 ステート

1 特長

- SCR ラッチアップ耐性の高い CMOS プロセスと回路設計
- 消費電力を大幅に低減した、バイポーラ FAST*/AS/S の速度
- 伝搬遅延時間の平衡化
- AC タイプは 1.5V～5.5V で動作し、バランスのとれたノイズ耐性を電源の 30% で実現
- ±24mA 出力駆動電流
  - 15 個の FAST* IC にファンアウト
  - 50Ω 伝送ラインを駆動

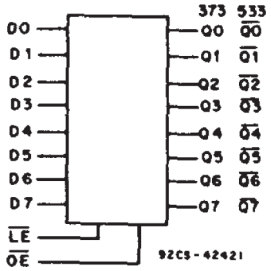
2 概要

RCA-CDx4AC373 および CDx4ACT373 は、RCA アドバンスト CMOS テクノロジを使用したオクタル トランスペアレント 3 ステート ラッチです。

製品情報

部品番号	パッケージ (1)	パッケージ サイズ(2)	本体サイズ (3)
CDx4AC/ACT373	DW (SOIC、20)	12.80mm × 10.3mm	12.80mm × 7.50mm
	N (PDIP、20)	24.33mm × 9.4mm	24.33mm × 6.35mm

(1) 利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。
(2) パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
(3) 本体サイズ (長さ×幅) は公称値であり、ピンは含まれません。



論理図 (正論理)

*FAST は Fairchild Semiconductor Corp. の登録商標です。

このリソースの元の言語は英語です。翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

Table of Contents

1 特長 ... 1
2 概要 ... 1
3 Pin Configuration and Functions ... 3
4 Specifications ... 4
4.1 Absolute Maximum Ratings ... 4
4.2 ESD Ratings ... 4
4.3 Recommended Operating Conditions ... 4
4.4 Thermal Information ... 5
4.5 Electrical Characteristics: AC Series ... 5
4.6 Electrical Characteristics: ACT Series ... 5
4.7 Prerequisite for Switching: AC Series ... 6
4.8 Switching Characteristics: AC Series ... 7
4.9 Prerequisite for Switching: ACT Series ... 7
4.10 Switching Characteristics: ACT Series ... 8
5 Parameter Measurement Information ... 9
6 Detailed Description ... 11
6.1 Overview ... 11
6.2 Functional Block Diagram ... 11
6.3 Functional Block Diagram ... 11
7 Application and Implementation ... 12
7.1 Power Supply Recommendations ... 12
7.2 Layout Guidelines ... 12
8 Device and Documentation Support ... 13
8.1 Documentation Support (Analog) ... 13
8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法 ... 13
8.3 サポート・リソース ... 13
8.4 Trademarks ... 13
8.5 静電気放電に関する注意事項 ... 13
8.6 用語集 ... 13
9 Revision History ... 13
10 Mechanical, Packaging, and Orderable Information ... 14

Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated

3 Pin Configuration and Functions

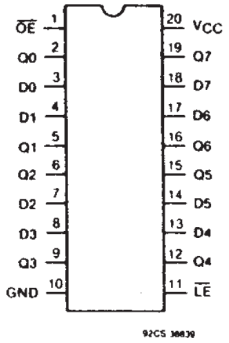


図 3-1. CDx4AC373, CDx4ACT373

PIN		I/O	DESCRIPTION
NAME	NO.		
$\overline{OE}$	1	Input	3-state output enable input
0Q	2	Output	Output for channel 0
0D	3	Input	Input for channel 0
1D	4	Input	Input for channel 1
1Q	5	Output	Output for channel 1
2Q	6	Output	Output for channel 2
2D	7	Input	Input for channel 2
3D	8	Input	Input for channel 3
3Q	9	Output	Output for channel 3
GND	10	—	Ground
$\overline{LE}$	11	Input	Latch enable input (active HIGH)
4Q	12	Output	Output for channel 4
4D	13	Input	Input for channel 4
5D	14	Input	Input for channel 5
5Q	15	Output	Output for channel 5
6Q	16	Output	Output for channel 6
6D	17	Input	Input for channel 6
7D	18	Input	Input for channel 7
7Q	19	Output	Output for channel 7
V_{CC}	20	—	Supply voltage

Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated

4 Specifications

4.1 Absolute Maximum Ratings

over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)(1)

			MIN	MAX	UNIT
V_{CC}	Supply-voltage		-0.5	6	V
I_{IK}	Input diode current	(V_I < -0.5 V or V_I > V_{CC} + 0.5 V)		±20	mA
I_{OK}	Output diode current	(V_O < -0.5 V or V_O > V_{CC} + 0.5 V)		±50	mA
I_O	Output source or sink current per output pin	(V_O > -0.5 V or V_O < V_{CC} + 0.5 V)		±50	mA
	V_{CC} or ground current, I_{CC} or I_{GND}			±100	mA(2)
T_{stg}	Storage temperature		-65	+150	°C

(1) Stresses beyond those listed under Absolute Maximum Ratings may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under Recommended Operating Conditions is not implied. Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended periods may affect device reliability.
(2) For up to 4 outputs per device; add ± 25 mA for each additional output.

4.2 ESD Ratings

			Value	UNIT
$V_{(ESD)}$	Electrostatic discharge	Human body model (HBM), per ANSI/ESDA/JEDEC JS-001(1)	±2000	V

(1) JEDEC document JEP155 states that 500-V HBM allows safe manufacturing with a standard ESD control process.

4.3 Recommended Operating Conditions

over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)(1)

	CHARACTERISTIC	MIN	MAX	UNIT
V_{CC} (2)	Supply-voltage			
	AC types	1.5	5.5	V
	ACT types	4.5	5.5	
V_I, V_O	Input or output voltage	0	V_{CC}	V
dt/dv	Input rise and fall slew rate			
	at 1.5 V to 3 V (AC types)	0	50	ns/V
	at 3.6 V to 5.5 V (AC types)	0	20	ns/V
	at 4.5 V to 5.5 V (ACT types)	0	10	ns/V
T_A	Operating-temperature range	-55	+125	°C

(1) All unused inputs of the device must be held at VCC or GND to ensure proper device operation. Refer to the TI application report: Implications of Slow or Floating CMOS Inputs.
(2) Unless otherwise specified, all voltages are referenced to ground.

Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated

4.4 Thermal Information

THERMAL METRIC[1]		CDx4AC/ACT373		UNIT
		N (PDIP)	DW (SOIC)	
		20 PINS	20 PINS	
$R_{\theta JA}$	Junction-to-ambient thermal resistance	50	101.2	°C/W

(1) For more information about traditional and new thermal metrics, see the *IC Package Thermal Metrics* application report (SPRA953).

4.5 Electrical Characteristics: AC Series

CHARACTERISTICS		TEST CONDITIONS		V_{CC} (V)	AMBIENT TEMPERATURE (T_A) - °C						UNIT
					+25		-40 to+85		-55 to +125		
		V_I (V)	I_O (mA)		MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	
V_{IH}	High-Level Input Voltage			1.5	1.2	—	1.2	—	1.2	—	V
				3	2.1	—	2.1	—	2.1	—	
				5.5	3.85	—	3.85	—	3.85	—	
V_{IL}	Low-Level Input Voltage			1.5	—	0.3	—	0.3	—	0.3	V
				3	—	0.9	—	0.9	—	0.9	
				5.5	—	1.65	—	1.65	—	1.65	
V_{OH}	High-Level Output Voltage	V_{IH} or V_{IL}	-0.05	1.5	1.4	—	1.4	—	1.4	—	V
			-0.05	3	2.9	—	2.9	—	2.9	—	
			-0.05	4.5	4.4	—	4.4	—	4.4	—	
			-4	3	2.58	—	2.48	—	2.4	—	
			-24	4.5	3.94	—	3.8	—	3.7	—	
		(1), (2)	-75	5.5	—	—	3.85	—	—	—	
			-50	5.5	—	—	—	—	3.85	—	
V_{IH} or V_{IL}	Low-Level Output Voltage	V_{IH} or V_{IL}	0.05	1.5	—	0.1	—	0.1	—	0.1	V
			0.05	3	—	0.1	—	0.1	—	0.1	
			0.05	4.5	—	0.1	—	0.1	—	0.1	
			12	3	—	0.36	—	0.44	—	0.5	
			24	4.5	—	0.36	—	0.44	—	0.5	
		(1), (2)	75	5.5	—	—	—	1.65	—	—	
			50	5.5	—	—	—	—	—	1.65	
I_I	Input Leakage Current	V_{CC} or GND		5.5	—	±0.1	—	±1	—	±1	μA
I_{OZ}	3-State Leakage Current	V_{IH} or V_{IL} V_O = V_{CC} or GND		5.5	—	±0.5	—	±5	—	±10	μA
I_{CC}	Quiescent Supply Current, MSI	V_{CC} or GND	0	5.5	—	8	—	80	—	160	μA

(1) Test one output at a time for a 1-second maximum duration. Measurement is made by forcing current and measuring voltage to minimize power dissipation.
(2) Test verifies a minimum 50-ohm transmission-line-drive capability at +85° C, 75 ohms at +125°C.

4.6 Electrical Characteristics: ACT Series

CHARACTERISTICS		TEST CONDITIONS		V_{CC} (V)	AMBIENT TEMPERATURE (T_A) - °C						UNIT
					+25		-40 to+85		-55 to +125		
		V_I (V)	I_O (mA)		MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	
V_{IH}	High-level input voltage			4.5 to 5.5	2	—	2	—	2	—	V
V_{IL}	Low-level input voltage			4.5 to 5.5	—	0.8	—	0.8	—	0.8	V
V_{OH}	High-level output voltage	V_{IH} or V_{IL}	-0.05	4.5	4.4	—	4.4	—	4.4	—	V
			-24	4.5	3.94	—	3.8	—	3.7	—	
		(1), (2)	-75	5.5	—	—	3.85	—	—	—	
			-50	5.5	—	—	—	—	3.85	—	

Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated

CHARACTERISTICS		TEST CONDITIONS		V_{CC} (V)	AMBIENT TEMPERATURE (T_A) - °C						UNIT
					+25		-40 to+85		-55 to +125		
		V_I (V)	I_O (mA)		MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	
V_{OH}	Low-level output voltage	V_{IH} or V_{IL}	0.05	4.5	—	0.1	—	0.1	—	0.1	V
			24	4.5	—	0.36	—	0.44	—	0.5	
		(1), (2)	75	5.5	—	—	—	1.65	—	—	
			50	5.5	—	—	—	—	—	1.65	
V_{OH}	Input leakage current	V_{CC} or GND		5.5	—	±0.1	—	±1	—	±1	
I_{OZ}	3-state leakage current	V_{IH} or V_{IL} V_O = V_{CC} or GND		5.5	—	±0.5	—	±5	—	±10	μA
I_{CC}	Quiescent supply current, msi	V_{CC} or GND	0	5.5	—	8	—	80	—	160	μA
	Additional quiescent supply current per input pin	V_{CC}-2.1		4.5 to 5.5	—	2.4	—	28	—	3	mA
ΔI_{CC}	TTL inputs high										
	1 unit load										

(1) Test one output at a time for a 1-second maximum duration. Measurement is made by forcing current and measuring voltage to minimize power dissipation.
(2) Test verifies a minimum 50-ohm transmission-line-drive capability at +85°C. 75 ohms at +125°C.

表 4-1. Act Input Loading Table

INPUT	UNIT LOAD(1)	
	ACT373	ACT533
$\overline{OE}$	0.87	0.87
Dn	0.5	0.5
$\overline{LE}$	0.8	08

(1) Unit load is ΔI_{CC} limit specified in Static Characteristics Chart, e.g. 2.4 mA max. @ 25°C.

4.7 Prerequisite for Switching: AC Series

SYMBOL	CHARACTERISTICS	V_{CC} (V)	AMBIENT TEMPERATURE (T_A) -°C				UNIT
			-40 to +85		-55 to +125		
			MIN	MAX	MIN	MAX	
t_W	$\overline{LE}$ Pulse Width	1.5	44	—	50	—	ns
		3.3(1)	4.9	—	5.6	—	
		5(2)	3.5	—	4	—	
t_{SU}	Setup Time Data to $\overline{LE}$	1.5	2	—	2	—	ns
		3.3	2	—	2	—	
		5	2	—	2	—	
t_H	Hold Time Data to $\overline{LE}$	1.5	33	—	38	—	ns
		3.3	3.7	—	4.2	—	
		5	2.6	—	3	—	

(1) 3.3 V: min. is @ 3 V
(2) 5 V: min. is @ 4.5 V

Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated

4.8 Switching Characteristics: AC Series

t_r, t_f = 3 ns, C_L = 50 pF

SYMBOL	CHARACTERISTICS	V_{CC} (V)	AMBIENT TEMPERATURE (T_A) - °C				UNIT
			-40 to +85		-55 to+125		
			MIN	MAX	MIN	MAX	
t_{PLH}	Propagation Delays: Data to Qn 373	1.5	—	96	—	106	ns
		3.3[1]	3.1	10.8	3	11.9	
t_{PHL}		5[2]	2.2	7.7	2.1	8.5	
t_{pLH}	533	1.5	—	119	—	131	ns
		3.3	3.8	13.4	3.7	14.7	
t_{PHL}		5	2.7	9.5	2.6	10.5	
t_{PLH}	$\overline{LE}$ on Qn 373	1.5	—	136	—	150	ns
		3.3	4.3	15.2	4.2	16.8	
t_{PHL}		5	3.1	10.9	3	12	
t_{PLH}	533	1.5	—	136	—	150	ns
		3.3	4.3	153	4.2	16.8	
t_{PHL}		5	3.1	10.9	3	12	
t_{PZL}	Output Enable Times	1.5	—	119	—	131	ns
		3.3	4.1	14.4	4	15.8	
t_{PZH}		5	2.7	9.5	2.6	10.5	
t_{PLZ}	Output Disable Times	1.5	—	131	—	144	ns
		3.3	3.7	13.1	3.6	14.4	
t_{PHZ}		5	3	10.5	2.9	11.5	
C_{PD} [3]	Power Dissipation Capacitance	—	63 Typ.		63 Typ.		pF
V_{OHV}	Min. (Valley) V_{OH} During Switching of Other Outputs (Output Under Test Not Switching)	5	4 Typ. @ 25° C				V
V_{OLP}	Max. (Peak) V_{OL} During Switching of Other Outputs (Output Under Test Not Switching)	5	1 Typ. @25° C				V
C_I	Input Capacitance	—	—	10	—	10	pF
C_O	3-State Output Capacitance	—	—	15	—	15	pF

(1) 3.3 V: min. is @ 3.6 V
(2) 5 V: min. is @ 5.5 V
(3) C_{PD} is used to determine the dynamic power consumption, per latch.

4.9 Prerequisite for Switching: ACT Series

SYMBOL	CHARACTERISTICS	V_{CC} (V)	AMBIENT TEMPERATURE (T_A) -°C				UNIT
			-40 to +85		-55 to +125		
			MIN	MAX	MIN	MAX	
t_W	$\overline{LE}$ Pulse Width	5[1]	3.6	—	4	—	ns
t_{SU}	Setup Time Data to $\overline{LE}$	5	2	—	2	—	ns
t_H	Hold Time Data to $\overline{LE}$	5	2.7	—	3	—	ns

(1) 5 V: min. is @ 4.5 V

Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated

4.10 Switching Characteristics: ACT Series

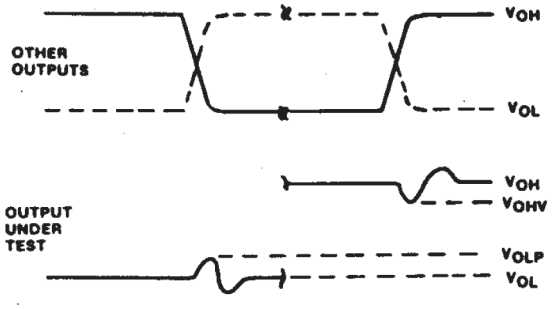
t_r, t_i = 3 ns, C_L = 50 pF

SYMBOL	CHARACTERISTICS	V_{CC} (V)	AMBIENT TEMPERATURE (T_A) -°C				UNIT
			-40 to +85		-55 to +125		
			MIN	MAX	MIN	MAX	
t_{PLH} t_{PHL}	Propagation Delays: Data to Qn 373	5(1)	2.7	9.5	2.6	10.4	ns
	533		3	10.4	2.9	11.4	
t_{PLH} t_{PHL}	$\overline{LE}$ to Qn 373 533	5	3.1	11.4	3	12.5	ns
t_{PZL} t_{PZH}	Output Enable Times	5	3.5	12.3	3.4	13.5	ns
t_{PLZ} t_{PHZ}	Output Disable Times	5	3.2	11.4	3.1	12.5	ns
C_{PD} (2)	Power Dissipation Capacitance	—	63 Typ.		63 Typ.		pF
V_{OHV}	Min. (Valley) V_{OH} During Switching of Other Outputs (Output Under Test Not Switching)	5	4 Typ. @ 25° C				V
V_{OLP}	Max. (Peak) V_{OL} During Switching of Other Outputs (Output Under Test Not Switching)	5	1 Typ. @25° C				V
C_I	Input Capacitance	—	—	10	—	10	pF
C_O	3-State Output Capacitance	—	—	15	—	15	pF

(1) 5 V: min. is @ 5.5 V
(2) C_{PD} is used to determine the dynamic power consumption, per latch.

Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated

5 Parameter Measurement Information



A. V_{OHV} AND V_{OLP} ARE MEASURED WITH RESPECT TO A GROUND REFERENCE NEAR THE OUTPUT UNDER TEST.
B. INPUT PULSES HAVE THE FOLLOWING CHARACTERISTICS: PRR ≤ 1 MHz, t_r = 3 ns, t_f = 3 ns, SKEW 1 ns.
C. R.F. FIXTURE WITH 700-MHz DESIGN RULES REQUIRED. IC SHOULD BE SOLDERED INTO TEST BOARD ANO BYPASSED WITH 0.1 *μF* CAPACITOR. SCOPE AND PROBES REQUIRE 700-MHz BANDWIDTH.
D. 92CS-42406

図 5-1. Simultaneous Switching Transient Waveforms.

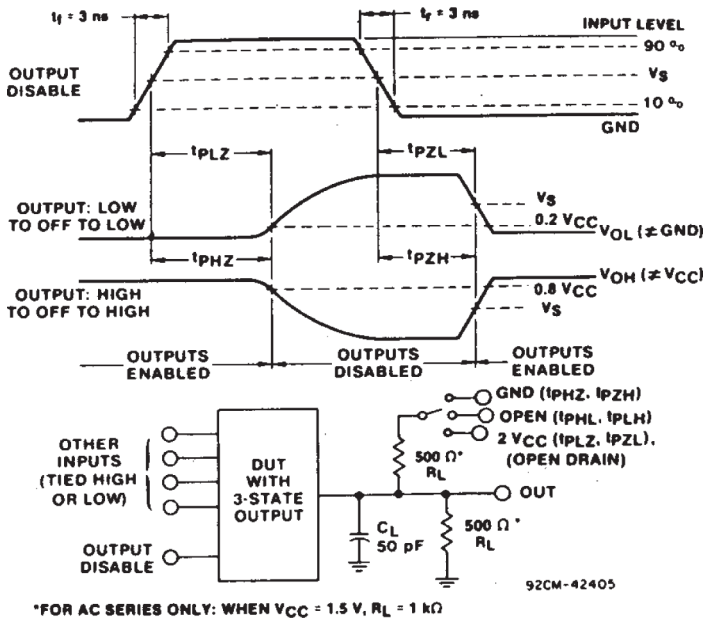


図 5-2. Three-state Propagation Delay Waveforms and Test Circuit.

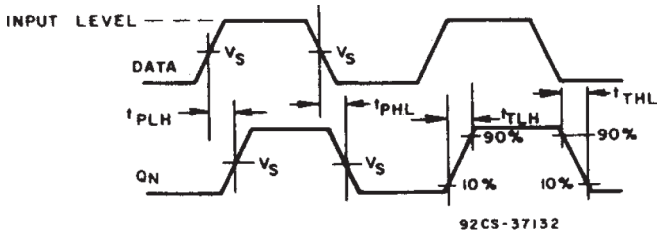


図 5-3. Data to Qn Output Propagation Delays and Output Transition Times.

Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated

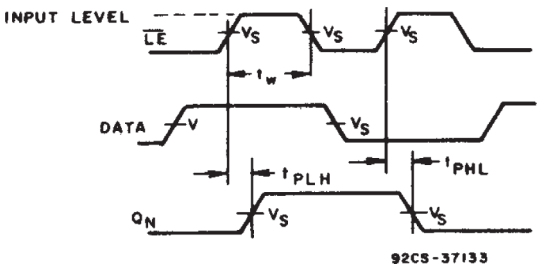


図 5-4. Latch Enable Propagation Delays.

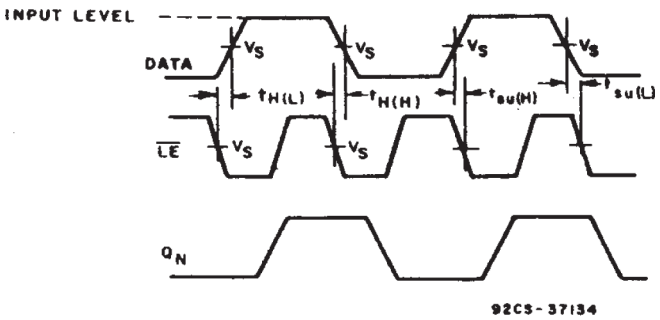


図 5-5. Latch Enable Prerequisite Times.

	CD54/74AC	CD54/74ACT
Input Level	V_{CC}	3 V
Input Switching Voltage, V_S	0.5 V_{CC}	1.5 V
Output Switching Voltage, V_S	0.5 V_{CC}	0.5 V_{CC}

Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated

6 Detailed Description

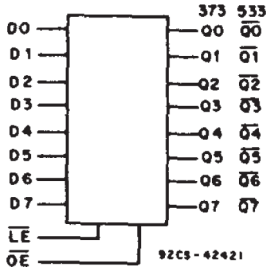
6.1 Overview

The RCA-CD54/74AC373 and the CD54/74ACT373 octal transparent 3-state latches use the RCA ADVANCED CMOS technology. The outputs are transparent to the inputs when the Latch Enable ($\overline{LE}$) is HIGH. When the Latch Enable ($\overline{LE}$) goes LOW, the data is latched. The Output Enable ($\overline{OE}$) controls the 3-state outputs. When the Output Enable ($\overline{OE}$) is HIGH, the outputs are in the high-impedance state. The latch operation is independent of the state of the Output Enable.

The CD74AC/ACT373 are supplied in 20-lead dual-in-line plastic packages (E suffix) and in 20-lead dual-in-line small-outline plastic packages (M suffix). Both package types are operable over the following temperature ranges: Commercial (0 to 70°C); Industrial (-40 to +85°C); and Extended Industrial/Military (-55 to +125°C).

The CD54AC/ACT373, available in chip form (H suffix), are operable over the -55 to +125°C temperature range.

6.2 Functional Block Diagram



6.3 Functional Block Diagram

表 6-1. Truth Table

$\overline{\text{Output}}$ Enable	$\overline{\text{Latch}}$ Enable	Data	AC/ACT373 Output
L	H	H	H
L	H	L	L
L	L	l	L
L	L	h	H
H	X	X	Z

7 Application and Implementation

7.1 Power Supply Recommendations

The power supply can be any voltage between the MIN and MAX supply voltage rating located in the *Recommended Operating Conditions* table.

Each VCC pin should have a good bypass capacitor to prevent power disturbance. For devices with a single supply, 0.1 µf is recommended; if there are multiple VCC pins, then 0.01 µf or 0.022 µf is recommended for each power pin. It is acceptable to parallel multiple bypass caps to reject different frequencies of noise. A 0.1 µf and a 1 µf are commonly used in parallel. The bypass capacitor should be installed as close to the power pin as possible for best results.

7.2 Layout Guidelines

7.2.1 Layout Guidelines

When using multiple bit logic devices inputs should not ever float. In many cases, functions or parts of functions of digital logic devices are unused, for example, when only two inputs of a triple-input AND gate are used or only three of the four buffer gates are used. Such input pins should not be left unconnected because the undefined voltages at the outside connections result in undefined operational states. Specified below are the rules that must be observed under all circumstances. All unused inputs of digital logic devices must be connected to a high or low bias to prevent them from floating. The logic level that should be applied to any particular unused input depends on the function of the device. Generally they will be tied to GND or V_{CC} whichever make more sense or is more convenient. Floating outputs is generally acceptable, unless the part is a transceiver. If the transceiver has an output enable pin it will disable the outputs section of the part when asserted. This will not disable the input section of the I.O's so they also cannot float when disabled.

Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated

8 Device and Documentation Support

8.1 Documentation Support (Analog)

8.1.1 Related Documentation

The table below lists quick access links. Categories include technical documents, support and community resources, tools and software, and quick access to sample or buy.

表 8-1. Related Links

PARTS	PRODUCT FOLDER	SAMPLE & BUY	TECHNICAL DOCUMENTS	TOOLS & SOFTWARE	SUPPORT & COMMUNITY
CD54AC373	Click here	Click here	Click here	Click here	Click here
CD74AC373	Click here	Click here	Click here	Click here	Click here
CD54ACT373	Click here	Click here	Click here	Click here	Click here
CD74ACT373	Click here	Click here	Click here	Click here	Click here

8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、www.tij.co.jp のデバイス製品フォルダを開いてください。[通知] をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。 変更の詳細については、改訂されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

8.3 サポート・リソース

テキサス・インスツルメンツ E2E™ サポート・フォーラムは、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計で必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インスツルメンツの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インスツルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インスツルメンツの使用条件を参照してください。

8.4 Trademarks

テキサス・インスツルメンツ E2E™ is a trademark of Texas Instruments.
すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

8.5 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

8.6 用語集

テキサス・インスツルメンツ用語集　　この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

9 Revision History

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

Changes from Revision * (April 2002) to Revision A (May 2024)	Page
• 「製品情報」表、「ピンの機能」表、「ESD 定格」表、「熱に関する情報」表、「デバイスの機能モード」、「アプリケーションと実装」セクション、「デバイスおよびドキュメントのサポート」セクション、および「メカニカル、パッケージ、および注文情報」セクションを追加	1
• Updated RθJA values: DW = 40 to 101.2, all values in °C/W	5

Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated

10 Mechanical, Packaging, and Orderable Information

The following pages include mechanical, packaging, and orderable information. This information is the most current data available for the designated devices. This data is subject to change without notice and revision of this document. For browser-based versions of this data sheet, refer to the left-hand navigation.

Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated

重要なお知らせと免責事項

テキサス・インスツルメンツは、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、テキサス・インスツルメンツ製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した テキサス・インスツルメンツ製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている テキサス・インスツルメンツ製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、テキサス・インスツルメンツはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。テキサス・インスツルメンツや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、テキサス・インスツルメンツおよびその代理人を完全に補償するものとし、テキサス・インスツルメンツは一切の責任を拒否します。

テキサス・インスツルメンツの製品は、テキサス・インスツルメンツの販売条件、または ti.com やかかる テキサス・インスツルメンツ製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。テキサス・インスツルメンツがこれらのリソースを提供することは、適用されるテキサス・インスツルメンツの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、テキサス・インスツルメンツはそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所:Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2024, Texas Instruments Incorporated

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package | Pins	Package qty | Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
CD54AC373F3A	Active	Production	CDIP (J) | 20	20 | TUBE	No	SNPB	N/A for Pkg Type	-55 to 125	CD54AC373F3A
CD54AC373F3A.A	Active	Production	CDIP (J) | 20	20 | TUBE	No	SNPB	N/A for Pkg Type	-55 to 125	CD54AC373F3A
CD54ACT373F3A	Active	Production	CDIP (J) | 20	20 | TUBE	No	SNPB	N/A for Pkg Type	-55 to 125	CD54ACT373F3A
CD54ACT373F3A.A	Active	Production	CDIP (J) | 20	20 | TUBE	No	SNPB	N/A for Pkg Type	-55 to 125	CD54ACT373F3A
CD74AC373E	Active	Production	PDIP (N) | 20	20 | TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	-55 to 125	CD74AC373E
CD74AC373E.A	Active	Production	PDIP (N) | 20	20 | TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	-55 to 125	CD74AC373E
CD74AC373M	Obsolete	Production	SOIC (DW) | 20	-	-	Call TI	Call TI	-55 to 125	AC373M
CD74AC373M96	Active	Production	SOIC (DW) | 20	2000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-55 to 125	AC373M
CD74AC373M96.A	Active	Production	SOIC (DW) | 20	2000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-55 to 125	AC373M
CD74ACT373E	Active	Production	PDIP (N) | 20	20 | TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	-55 to 125	CD74ACT373E
CD74ACT373E.A	Active	Production	PDIP (N) | 20	20 | TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	-55 to 125	CD74ACT373E
CD74ACT373M	Obsolete	Production	SOIC (DW) | 20	-	-	Call TI	Call TI	-55 to 125	ACT373M
CD74ACT373M96	Active	Production	SOIC (DW) | 20	2000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-55 to 125	ACT373M
CD74ACT373M96.A	Active	Production	SOIC (DW) | 20	2000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-55 to 125	ACT373M

(1) **Status:** For more details on status, see our product life cycle.

(2) **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

(3) **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the TI RoHS Statement for additional information and value definition.

(4) **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

(5) **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

(6) **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

OTHER QUALIFIED VERSIONS OF CD54AC373, CD54ACT373, CD74AC373, CD74ACT373 :

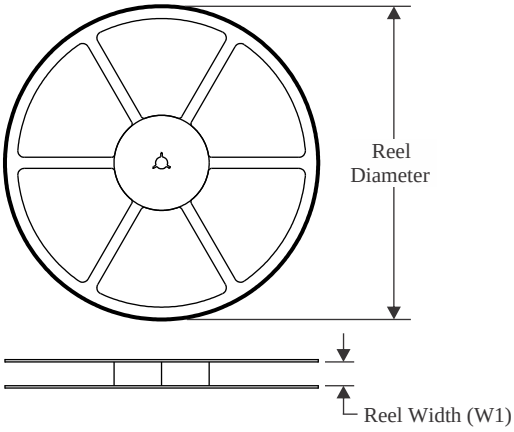
- Catalog : CD74AC373, CD74ACT373
- Military : CD54AC373, CD54ACT373

NOTE: Qualified Version Definitions:

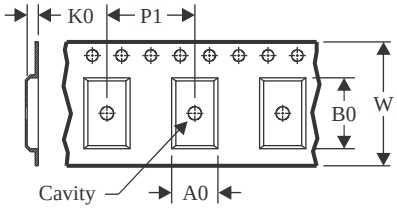
- Catalog - TI's standard catalog product
- Military - QML certified for Military and Defense Applications

TAPE AND REEL INFORMATION

REEL DIMENSIONS

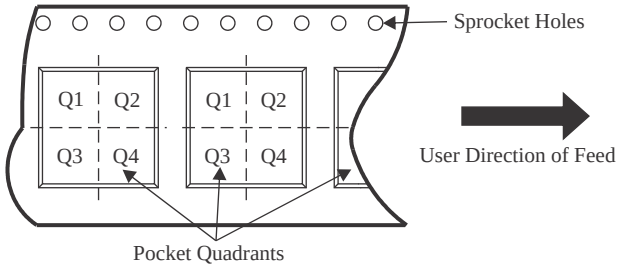


TAPE DIMENSIONS



A0	Dimension designed to accommodate the component width
B0	Dimension designed to accommodate the component length
K0	Dimension designed to accommodate the component thickness
W	Overall width of the carrier tape
P1	Pitch between successive cavity centers

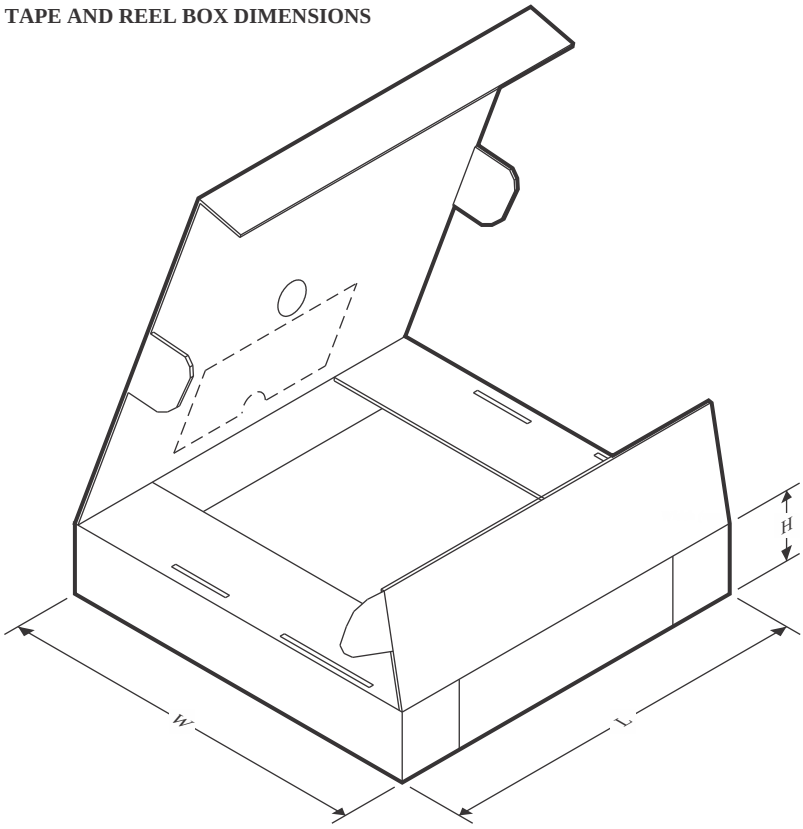
QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE



*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
CD74AC373M96	SOIC	DW	20	2000	330.0	24.4	10.8	13.3	2.7	12.0	24.0	Q1
CD74AC373M96	SOIC	DW	20	2000	330.0	24.4	10.9	13.3	2.7	12.0	24.0	Q1
CD74ACT373M96	SOIC	DW	20	2000	330.0	24.4	10.8	13.3	2.7	12.0	24.0	Q1

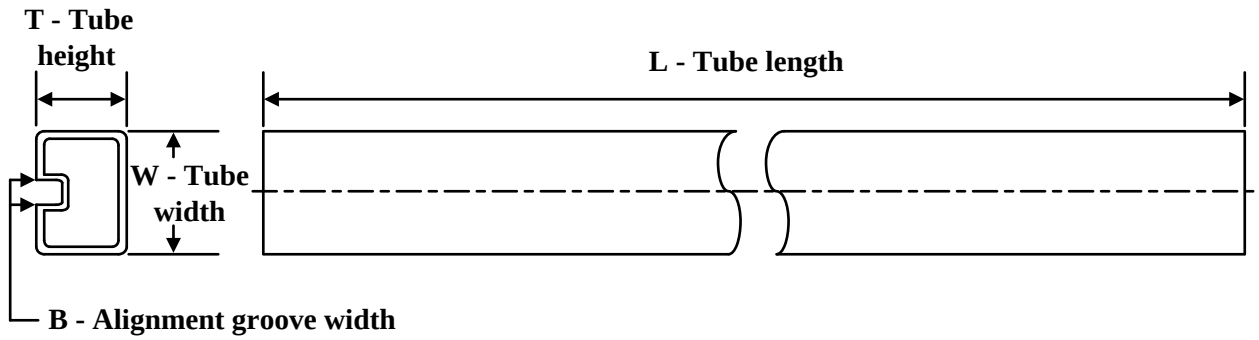
TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS



*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
CD74AC373M96	SOIC	DW	20	2000	356.0	356.0	45.0
CD74AC373M96	SOIC	DW	20	2000	356.0	356.0	45.0
CD74ACT373M96	SOIC	DW	20	2000	356.0	356.0	45.0

TUBE



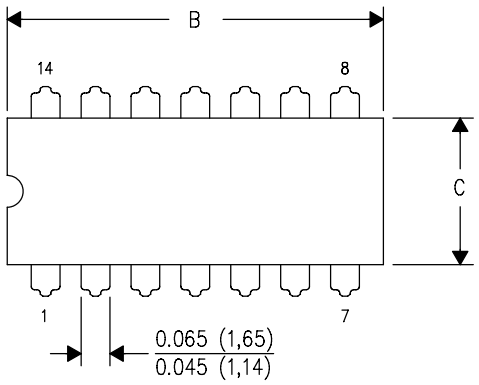
*All dimensions are nominal

Device	Package Name	Package Type	Pins	SPQ	L (mm)	W (mm)	T (µm)	B (mm)
CD74AC373E	N	PDIP	20	20	506	13.97	11230	4.32
CD74AC373E.A	N	PDIP	20	20	506	13.97	11230	4.32
CD74ACT373E	N	PDIP	20	20	506	13.97	11230	4.32
CD74ACT373E.A	N	PDIP	20	20	506	13.97	11230	4.32

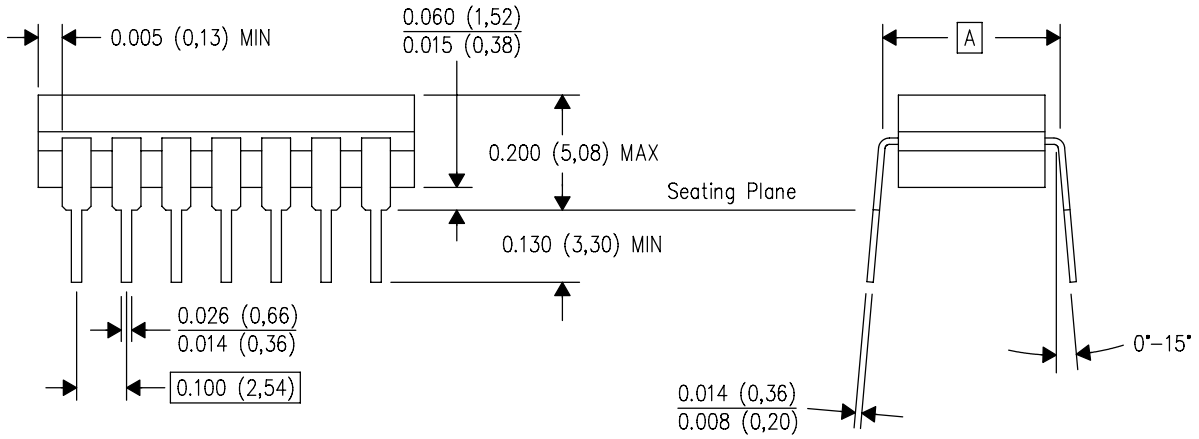
J (R–GDIP–T**)

14 LEADS SHOWN

CERAMIC DUAL IN–LINE PACKAGE



DIM \ PINS **	14	16	18	20
A	0.300 (7,62) BSC	0.300 (7,62) BSC	0.300 (7,62) BSC	0.300 (7,62) BSC
B MAX	0.785 (19,94)	.840 (21,34)	0.960 (24,38)	1.060 (26,92)
B MIN	—	—	—	—
C MAX	0.300 (7,62)	0.300 (7,62)	0.310 (7,87)	0.300 (7,62)
C MIN	0.245 (6,22)	0.245 (6,22)	0.220 (5,59)	0.245 (6,22)



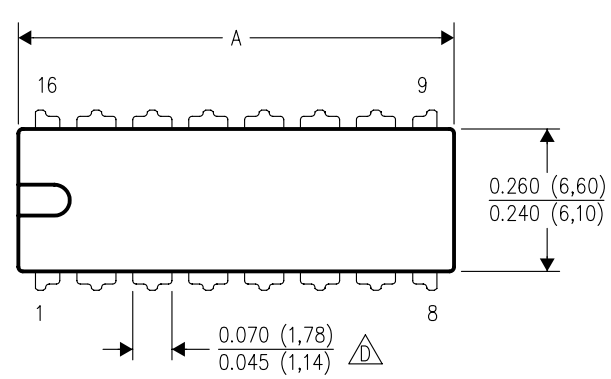
4040083/F 03/03

NOTES:
A. All linear dimensions are in inches (millimeters).
B. This drawing is subject to change without notice.
C. This package is hermetically sealed with a ceramic lid using glass frit.
D. Index point is provided on cap for terminal identification only on press ceramic glass frit seal only.
E. Falls within MIL STD 1835 GDIP1–T14, GDIP1–T16, GDIP1–T18 and GDIP1–T20.

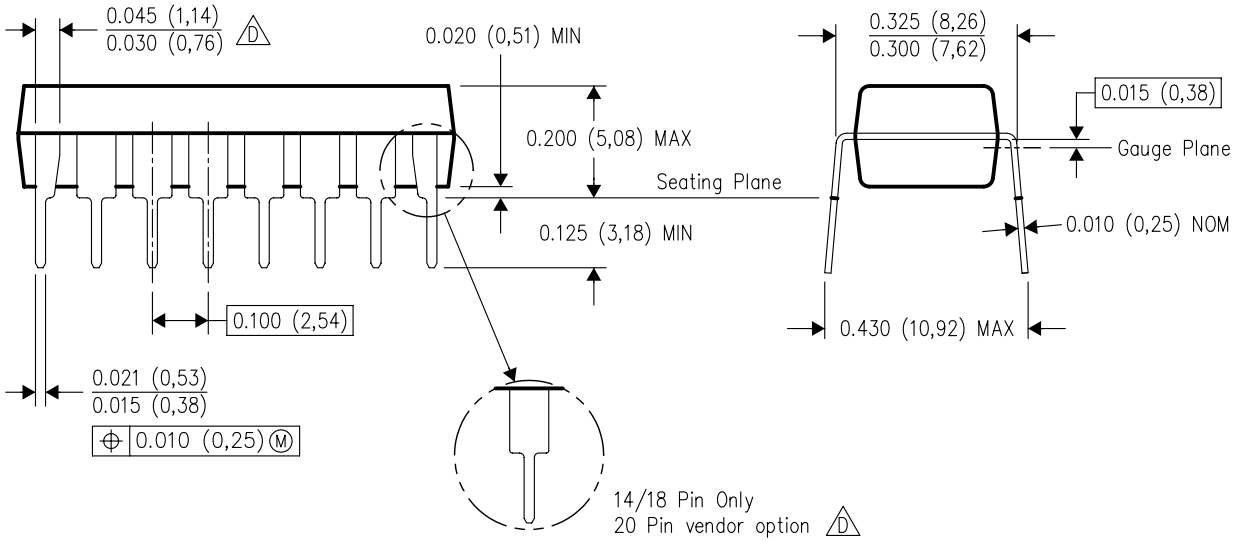
N (R–PDIP–T**)

PLASTIC DUAL–IN–LINE PACKAGE

16 PINS SHOWN

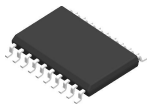


DIM \ PINS **	14	16	18	20
A MAX	0.775 (19,69)	0.775 (19,69)	0.920 (23,37)	1.060 (26,92)
A MIN	0.745 (18,92)	0.745 (18,92)	0.850 (21,59)	0.940 (23,88)
MS–001 VARIATION (C)	AA	BB	AC	AD



4040049/E 12/2002

NOTES:
A. All linear dimensions are in inches (millimeters).
B. This drawing is subject to change without notice.
C. Falls within JEDEC MS–001, except 18 and 20 pin minimum body length (Dim A).
D. The 20 pin end lead shoulder width is a vendor option, either half or full width.

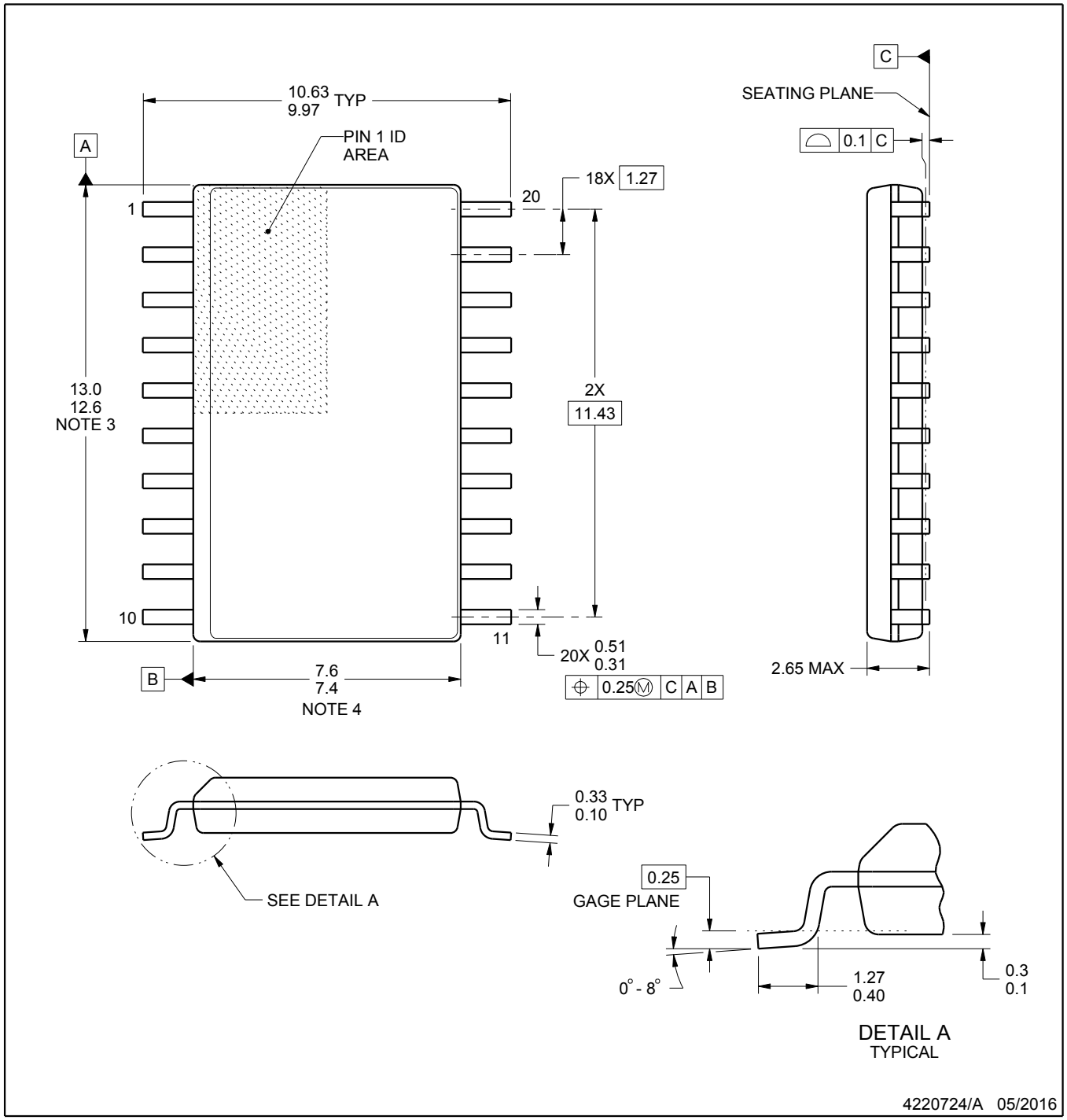


PACKAGE OUTLINE

DW0020A

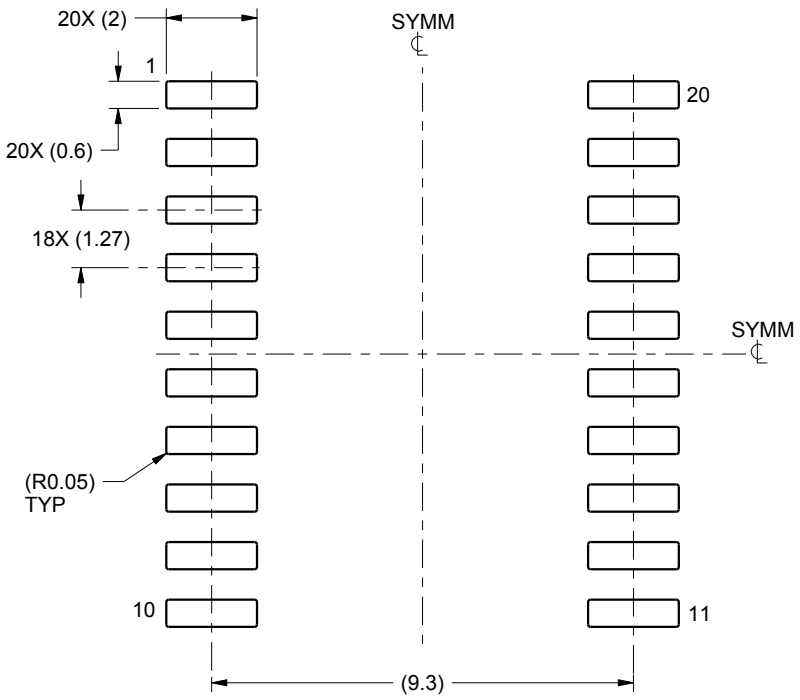
SOIC - 2.65 mm max height

SOIC

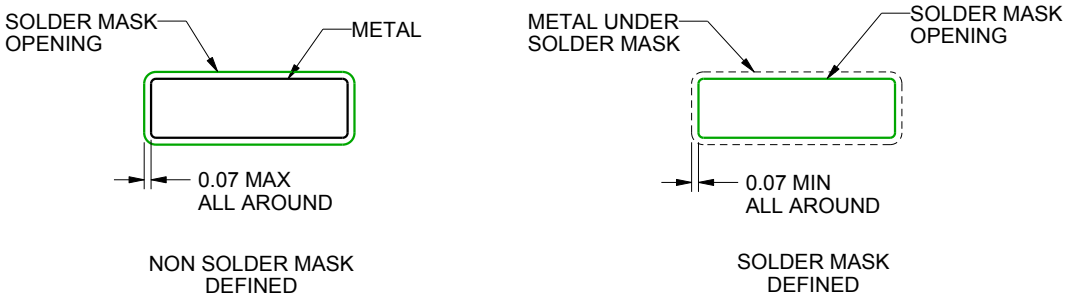


NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.43 mm per side.
5. Reference JEDEC registration MS-013.



LAND PATTERN EXAMPLE
SCALE:6X

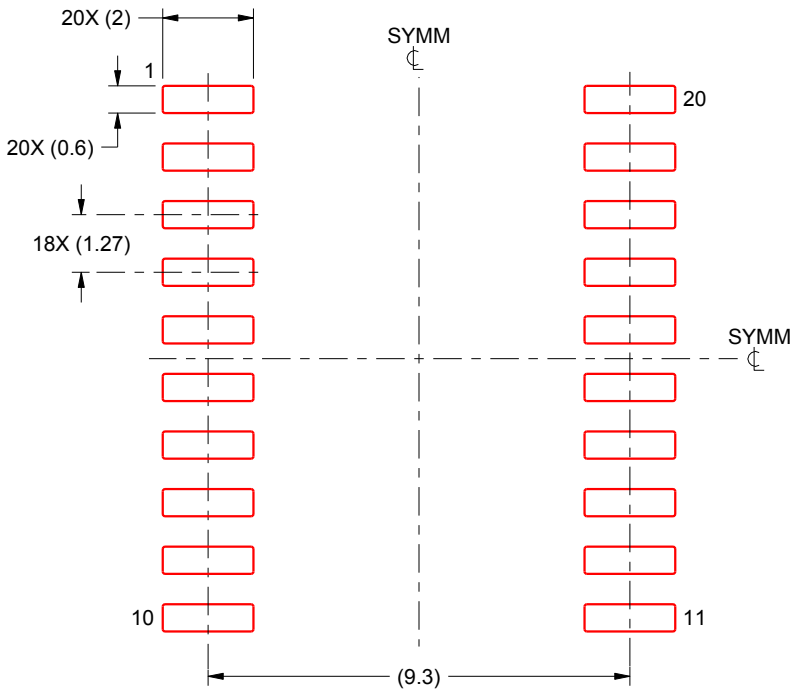


SOLDER MASK DETAILS

4220724/A 05/2016

NOTES: (continued)

6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE:6X

4220724/A 05/2016

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

重要なお知らせと免責事項

TI は、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、 TI の販売条件 、 TI の総合的な品質ガイドライン 、 ti.com または TI 製品などに関連して提供される他の適用条件に従い提供されます。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。 TI がカスタム、またはカスタマー仕様として明示的に指定していない限り、TI の製品は標準的なカタログに掲載される汎用機器です。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案する場合も、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

Copyright © 2026, Texas Instruments Incorporated

最終更新日：2025 年 10 月